PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-012545

(43)Date of publication of application: 16.01.1998

(51)Int.Cl.

H01L 21/027 H01L 21/3065

(21)Application number: 09-063756

(71)Applicant: MOTOROLA INC

(22)Date of filing:

03.03.1997

(72)Inventor: MARACAS GEORGE N

LEGGE RONALD N GORONKIN HERBERT DWORSKY LAWRENCE N

(30)Priority

Priority number: 96 608022

Priority date: 04.03.1996

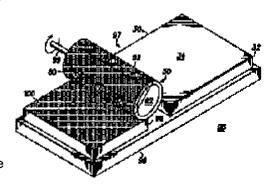
Priority country: US

(54) APPARATUS AND METHOD FOR FORMING PATTERN ON SURFACE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To form a pattern which is reproducible on a large-area surface with a high cost efficiency.

SOLUTION: An apparatus 95 has a large-area stamp 50 for forming a self- aggregated monomolecular layer(SAM) of a molecular species on the surface of a resist layer 32, formed on the surface of a work 30. This stamp 50 has an elastomer layer 52 with mechanical structures buried therein to reinforce the stamp 50 and deform it to thereby control a stamped pattern. This method comprises forming the resist layer 32 on the surface of the work 30, forming the SAM on the surface 34 of the resist layer 32, etching the resist layer 32, and etching or plating the surface of the work 30.



(19)日本国符許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出職公開番号

特開平10-12545

(43)公開日 平成10年(1998)1月16日

審査請求 未請求 適求項の数5 FD (全 9 頁)

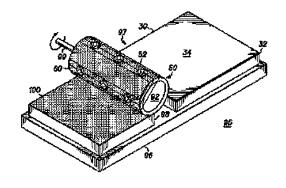
(21)出顯器号	特顯平9-63756	(71)出顧人	390009597
			モトローラ・インコーポレイテッド
(22)出顧日	平成9年(1997)3月3日		MOTOROLA INCORPORAT
			RED
(31) 優先權主張發号	608022		アメリカ合衆国イリノイ州シャンバーグ、
(32) 優先日	1996年3月4日		イースト・アルゴンクイン・ロード1303
(33)優先権主張国	米国 (US)	(72)発明者	ジョージ・エヌ・マラカス
			アメリカ合衆国アリゾナ州フェニックス、
		Į	イースト・ビッグホーン・アベニュー2613
		(72)発明者	ロナルド・エヌ・レジー
		' ' ' ' ' ' '	アメリカ合衆國アリゾナ州スコッツデー
			ル、イースト・エル・ニド・レーン8744
		(74)代理人	
			最終質に続く
			7000000

(54)【発明の名称】 表面にパターニングを行う装置および方法

(57)【要約】

【課題】 対象物(30)の表面にバターニングを行う 装置(95)および方法を提供する。

【解決手段】 装置(95)は、対象物(30)の表面上に形成された。レジスト物質層(32)の表面(34)上に、分子種(38)の自己集合単分子層(36)(SAM)を形成するための大面積スタンプ(50)を含む。大面積スタンプ(50)は、エラストマ層(52)を含み、その中に機械的構造体(68、80)が埋め込まれている。機械的構造体(68、80)は、大力されるバターンを制御する。本発明の方法は、対象物(30)の表面上にレジスト物質層(32)を形成する段階、大面積スタンプ(50)を用いてレジスト物質層(32)の表面にエッチングを行う段階、およびその後に対象物(30)の表面にエッチングまたはメッキを縮す段階から成る。



特関平10-12545

(2)

【特許請求の範囲】

【請求項1】対象物(30)の表面にバターニングを行 う方法であって:第1 および第2 対向面(5.4、5.6) を有する可撓性物質層(52)を用意する段階;前記可 鏡性物質層(52)の前記第1対向面(54)にレリー フ(58)を形成する段階であって、前記レリーブ(5 8) は、第1の所定パターンを規定する複数の接触面 (60) を有し、前記レリーフ (58) は第2の所定パ ターンを規定する押込(62)を含む前記段階;自己集 台単分子層形成分子種(38)を含有する溶液で、前記(10)とする大面積スタンプ(50)。 複数の接触面(60)を濡らすことにより、複数の濡れ た接触面を設ける段階;前記対象物(30)の表面上 に、前記自己集合単分子層形成分子種(38)が結合す る外面(34)を有する。レジスト物質層(32)を形 成する段階;その後、前記複数の濡れた接触面を、前記 レジスト物質層(32)の前記外面(34)と接触させ る段階: その後、前記複数の接触面(60)を除去する ことにより、前記レジスト物質層(32)の前記外面 (34)上に、前記自己集合単分子層形成分子種(3 8)の自己集合単分子層(36)を形成し、かつ前記第 20 2の所定パターンを有する前記レジスト物質層 (32) の前記外面(34)の露出領域を設ける段階;および前 記自己集合単分子層(36)に対しては不活性なエッチ ャントを用いて、前記レジスト物質層(32)の前記外 面(34)の露出領域にエッチングを行うことにより、 前記第2の所定バターンを有する前記対象物(30)の 表面の露出領域を設ける段階;から成ることを特徴とす る方法。

【請求項2】分子種(38)の自己集合単分子層(3 6)を、表面積が1平方インチよりも広いレジスト物質 30 圏(32)の外面(34)に被着するための大面積スタ ンプ(50)であって:第1および第2対向面(54, 56)を有し、前記第1対向面(54)が1平方インチ よりも広い表面積を有する。エラストで物質層(5 2) ; および前記エラストで物質層 (52) の前記第1 対向面(54)内に形成されたレリーフ(58)であっ て、第1の所定バターンを規定する複数の接触面(6 (1) と、第2の所定バターンを規定する押込(62)と を育する前記レリーフ(58);から成ることを特徴と ずる大面積スタンプ (50)。

【請求項3】分子種(38)の自己集合単分子層(3 6)を、表面積が1平方インチよりも広いレジスト物質 層(32)の外面(34)に被者するための大面積スタ ンプ(50)であって:第1および第2対向面(54, 56)を有し、前記第1対向面(54)が1平方インチ よりも広い表面積を有しかつ輪郭特性を有する。エラス トマ物質層(52);前記エラストマ物質層(52)内 に配された循葉材(68)であって、前記第1対向面 《54)の輪郭特性が前記補強材(68)によって劣化 されないように、前記第1対向面(54)から十分な距 50 置。

離を置いて配された前記補強材(68);および前記エ ラストマ物質層(52)の前記第1対向面(54)内に 形成されたレリーフ (58) であって、第1の所定パタ ーンを規定する複数の接触面(60)と、第2の所定パ ターンを規定する押込(62)とを有する前記レリーフ (58);から成り、

前記補強材(68)が、前記エラストで物質層(52) の前記第1対向面(54)内の前記第1および第2の所 定パターンを維持する、構造的支持を与えることを特徴

【請求項4】分子種(38)の自己集合単分子層(3 6)を、表面積が1平方インチよりも広いレジスト物質 層 (32) の外面 (34) に被着するための大面積スタ ンプ(50)であって:第1および第2対向面(54, 56)を有し、前記第1対向面(54)が1平方インチ よりも広い表面積を有する。エラストで物質層(5 2) : 前記エラストマ物質層(52)内に埋め込まれた 複数の圧電構造体(80);前記エラストマ物質層(5 2)の前記第1対向面(54)内に形成されたレリーフ (58)であって、第1の所定パターンを規定する複数 の接触面(60)と、第2の所定バターンを規定する押 込(62)とを育する前記レリーフ(58);から成

前記複数の圧電標造体(80)を有する前記大面積スタ ンプ(50)に適切な補正電圧を印加するときに、前記 大面積スタンプ(50)内に機械的補正力を与えること によって、前記第1および第2の所定バターンの維持お よび副御を可能とすることを特徴とする大面積スタンプ $\{50\}_{a}$

【請求項5】分子種の自己集合単分子層(36)をレジ スト物質層(32)の外面(34)に被着させる装置 (95)であって:外面(94)を有する硬質シリンダ (92);第1および第2対向面(54,56)を有 し、前記第2対向面(56)が前記観覧シリンダ(9) 2) の前記外面(94)に固着している可撓性物質層 (52);前記可鐃性物質層(52)の前記第1対向面 (54) に形成されたレリーフであって、第2の所定パ ターンを規定する押込(62)と、第1の所定バターン を規定する複数の接触面(60)とを含む前記レリー 40 フ;前記硬質シリンダ(92)を回転させる手段;前記 レジスト物質層(32)を有する基板(97)を保持す る支持構造体(96)であって、前記観覧シリンダ(9 2) は前記支持構造体 (96) 上に配され、前記墓板 (97)を前記支持基板(96)上に配置した後、前記 硬質シリンダ(92)が前記レジスト物質層(32)の 前記外面(34)上を転動可能とする前記支持構造体 (96):および自己集合単分子層形成化学種(38) を含有する溶液(100)で、前記複数の接触面(6 (1)の一部を溜らす手段;から成ることを特徴とする装

http://www4.ipdl.inpit.go.jp/tjcontenttrns.ipdl?N0000=21&N0400=image/gif&N0401=/NS...

9/2/2008

(3)

特関平10-12545

3

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、マイクロエレクト ロニクス素子。センサ、および光学素子の分野に関し、 更に特定すれば、1平方インチ以上の表面領域を有する 大面積の表面にバターニングを行う装置方法に関するも のである。

[0002]

【従来の技術】表面にミクロンまたはサブミクロン構造 をバターニングする(エッチングまたはメッキ)従来技「10」することができない。この従来技術における欠陥は、表 衛の方法は、フォトリングラフィ、電子ビーム・リング ラフィ、および x 線リングラフィのような、照射式リン グラフィ法(irradiative lithographicmethod)を含む。 これらの方法はどれも皆時間がかかり、しかもコストが 高く保守にも多大の費用を要する機器を必要とする。ま た。従来の照射式リングラフィ方法において使用される 機器では、大きな面積の素子を形成するのは容易ではな い。かかる装置によるパターエングは小さな面積に限ち れており、大きな面積の素子を製造する場合、小さな面 插のパターニングを継ぎ合わせて一体化しなければなら 20 le) の表面にパターニングを行う装置および方法を提供 ない。典型的に、MRSによって生産されているよう な。パネル・プリンタによって現在パターニングが可能 な最大のフィールド(field) の面績は、約12平方イン チであり、典型的な半導体用途向けフォトリソグラフィ ・ステッパは、約1平方インチの面積のフィールドを有 する。

【0003】一例として、電界放出ディスプレイ(field emission display)は、当技術では既知の電界放出素子 のアレイを利用している。電界放出素子の構造およびそ の製造方法の一例は、1974年2月5日に特許され た。"Field Emission CathodeStructures, Devices Uti Trizing Such Structures, and Methods of ProducingSu ch Structures"と題する米国特許香号第3, 789, 4 71号に数示されている。この特許の内容は本願でも使 用可能である。エミッタ・ウエルを形成し、素子の導体 行および導体列をバターニングするためには、従来のフ ォトリングラフィ方法が用いられる。電界放出ディスプ レイにおける電界放出素子のアレイの寸法は、大きくば ちつく可能性がある。例えば、対角線長さが10.25 では現実的な値である。入手可能なフォトリソグラフィ 機器。即ち、ステッパでは、ディスプレイに必要な素子。 の寸法を得るためには、多数のフィールドのパターンを 形成し、これらを継ぎ合わせて一体化しなければならな い。各ステッパには約5百万ドルの費用がかかり、しか。 も継ぎ合わせプロセスは非常に時間がかかる。

【0004】したがって、ミクロンまたはサブミクロン 構造を表面にバターエングする方法において、低コスト で保守費用も安い機器を利用し、しかも大面積の素子を

により、高いスループットが得られる。改良された方法 が必要とされている。

【①)①5】自己集合単分子層(SAM:self-assembl ed molecularmonolayer)のマイクロ・コンタクト印刷(m nero-contact printingは、当技術では既知である。S AMは、ある種の個体に結合する官能量を有する分子か ち成り、残りの分子は隣接する分子と相互作用を行って 高密度の構造を形成する。現在のマイクロ・コンタクト 印刷方法は、信頼性高くあるいは再規可能に表面を印刷 面領域が約1平方インチより大きな大面積の表面の印刷 において、最も著しいものとなる。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】したがって、本発明の 全体としての目的は、コスト効率が高く、再現可能な、 大面積の表面にバターニングを行う方法を提供すること である。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明は、対象物(artic する。この装置は、対象物の表面上に形成された。レジ スト物質層の表面上に、分子種の自己集合単分子層(S AM)を形成するための大面積スタンプを含む。大面積 スタンプは、エラストマ層を含み、その中に緩緩的構造 体が埋め込まれている。機械的構造体は、大面積スタン プを補強し、それを変形してスタンプされるパターンを 制御する。本発明の方法は、対象物の表面上にレジスト 物質層を形成する段階、大面積スタンプを用いてレジス ト物質層の表面上にSAMを形成する段階、レジスト物 30 質層にエッチングを行う段階、およびその後に対象物の 表面にエッチングまたはメッキを施す段階から成る。

[0008]

【発明の実施の形態】まず図1ないし図6を参照する と、本発明による表面パターニング方法の一実施例を実 施することによって形成される、中間構造が示されてい る。図1には、対象物30.レジスト物質層32.およ び自己集合単分子層形成分子種(self-assembled monola yer-forming molecular species)38の自己集合単分子 層(SAM)36が示されている。バターエングすべき インチのディスプレイは、最終製品のディスプレイとも、40 対象物30の表面上に、まずレジスト物質層32を形成 することによって、対象物30にパターニング(エッチ ングまたはメッキ〉を行う。次に、SAM36を、レジ スト物質層32の外面34上に形成する。SAM36 は、SAM形成分子種38によって規定された第1の所 定パターンを有し、外面34の露出領域は第2の所定バ ターンを規定する。SAM36に対しては不活性なエッ チャントを用いて、外面34の露出領域にエッチングを 行う。図1に概略的に示すように、SAM形成分子種3 8は2つの部分を含む。即ち、レジスト物質層32の外 迅速に、容易に、かつ再視可能にパターニングすること 50 面34に結合する第1の官能基40と、高密度層を形成 (4)

する第2の官能基42である。高密度層は、エッチャン トがSAM36の下に位置する外面34の部分を攻撃す るのを物理的および/または化学的に阻止することがで きる。エッチャントは、図1において矢印で示すよう に、外面34の露出領域を攻撃する。第1エッチング工 程によって得られる構造を図2に示す。図2では、矢印 を錯くことによって、第2エッチャントの作用も示して いる。対象物30内に第2の所定バターンをエッチング するために、レジスト物質層32に対しては不活性なエ ッチャントを選択する。との第2エッチング工程に先立 ち、有機溶剤を用いてSAM36を除去することが可能 である。第2エッチング工程の結果を図3に示す。ある いは、図5に示すように、図2の構造をエッチングする 代わりに、対象物30の表面の露出領域上に、メッキ物 質44をメッキすることも可能である。その後、レジス ト物質層32を除去すれば、第2の所定バターンを有す るメッキ物質44が対象物30の表面に残ることにな る。メッキ物質44は導体とすればよい。

【0009】レジスト物質層32およびSAM形成分子 種38は、SAM36の適切な結合擎勁および耐エッチ ング性が得られるように選択する。加えて、レジスト物 | 質層32は、対象物30の表面に対して十分な接着力が なければならない。適切な組み合わせとしては、チタ ン、アルミニウム、金、クローム、ニッケル、銅、およ び銀から成る群から選択した金属で形成したレジスト物 質層32を含み、SAM形成分子種38はヘキサデカン エチオル (hexadecanethrol) のようなアルキルチオル (a fikyīthroī)を含む。別の可能なレジスト/SAMの組み 合わせは、チタン、アルミニウム、ニッケル、銅、およ びクロームから成る群から選択した金属で形成するか、 あるいは二酸化シリコン、酸化アルミニウム、および窒 化シリコンから成る群から選択した誘電体で形成したレ ジスト物質圏32を含み、この場合、SAM形成分子種 38はアルキルトリクロロシラン(alkyltrichlorosilan e)を含む。更に別の可能なレジスト/SAMの組み合わ せは、二酸化シリコン、酸化アルミニウム、または窒化 シリコンのような誘電体で形成したレジスト物質層32 を含み、SAM形成分子種38は、この組み合わせで は、アルキルシロキサン(alkylsiloxane) を含む。SA M有機物は、販売業者から容易に入手可能である。これ らは液体状で販売され、典型的に研究室でマイクロ・モ ル濃度(micro molarconcentration)に番訳される。典型 的な溶液は、エタノールおよびクロロフォルムである が、他の溶液も可能である。

【0010】次に図7を参照すると、本発明による大面 請スタンプ50の実施例の等幅図が示されている。大面 請スタンプ50を利用して、レジスト物質層32の外面 34上にSAM36を印刷し、層32の下に位置する対象物に対するバターニングを可能とする。大面積スタンプ50は、第1対向面54と第2対向面56とを得す

る。可魏铨物質層52を含む。第1対向面54はレリー フ(refref)58を含み、このレリープ58は、複数の押 込62 (漢、孔、または開口とも呼ぶ)と、これら複数 の鉀込62の間に位置する複数の接触面60とを有す る。第1対向面54は、1平方インチよりも大きな表面 満を育する。多くのマイクロエレクトロニクス素子が今 日ではミクロンまたはサブミクロン構造を含む。そのよ うな構造を形成するために、押込62は、0.1ないし 1000ミクロンの範囲の寸法Dを有する。他の用途で は、寸法Dは1000ミクロンよりも大きい。可撓健物 質層52は、ポリジメチルシロキサン・エラストで(pol ydimethylsiloxane elastomer)のような弾性物質で作ら れる。これはDowCorningから購入することができる。 【0011】次に図8を参照すると、複数の接触面60 によって規定された第1の所定パターンが描かれてい る。また、図9には、挿込62によって規定された第2 の所定パターンが描かれている。

【0012】次に図10を参照すると、図7の大面清スタンプ50を形成するための、本発明によるスタンプ鋳造原型(stamp-casting master)64の等幅図が示されている。スタンプ鋳造原型64は、レリーフ58の補体である。相緒レリーフ66を有する。硬化性流体、即ち、可持性物質圏52の流体先駆体(fluidprecursor)を注入する。即ち、スタンプ鋳造原型64の相消レリーフ66と接触させる。次に、硬化性流体を硬化させ、とれによって大面請スタンプ50を形成する。その後、大面請スタンプ50を入り外す。 【0013】大面請スタンプ50を利用して、レジスト物質層32の傾而34に84M36を練着する。木公明

物質層32の外面34にSAM36を被着する。本発明 30 による対象物表面にパターニングを行う方法の一実施例 では、まず、上述の溶剤の1つを含むSAM形成分子種 38を含有する溶液で複数の接触面60を濡らすことに よって、SAM36をレジスト物質層32の外面34上 に形成する。溶剤は、複数の接触面60から蒸発する。 次に、大面積スタンプ50とレジスト物質層32の外面 34との位置合わせを行い、対象物30のバターニング を対象物30上に適切に位置付け、適用可能であれば、 対象物30上に予め存在するいずれかのパターンに対し て、所定の配向でパターエングを行う。この後、複数の 40 接触面60を外面34と接触させる。次に、大面積スタ ンプ50を除去し、SAM36を残す。SAM形成分子 種38は第1の所定パターンを有し、外面34の露出鎖 域は第2の所定バターンを有する。次いで、SAM36 に対しては不活性なエッチャントを用いて、外面34の 舊出領域にエッチングを行う。例えば、レジスト物質層 32がアルミニウムを含み、SAM形成分子種38がア ルキルチオルを含む場合に適したエッチャントは、フェ リシアニド (fermicyanide)である。このエッチング工程 で、後にエッチングまたはめっきを行う露出領域を対象 50 物30の表面に設ける。この後続のエッチングまたはめ

(5)

っき工程を実行するために必要な化学物質で適切なもの は、当業者には既知であるろ。上述のように対象物30 にバターニングを行った後、続いてレジスト物質層32 を除去するか、更にパターニングを施すか、あるいは外 面34上に残しておく。対象物30は、エッチングの際 に、モールドとして利用することができる。

【①①14】バターエングを行う多くの場合において、 1.平方インチよりも大きな表面領域を有する面のバター ニングを伴う。大面満スタンプ50を利用すれば、表面 全体に同時にバターエングが可能であり、これによっ て、従来技術の大面積パターニング方法では必要な、継 ぎ合わせプロセスを回避することができる。このような タイプの用途では、そして本発明によれば、大面積スタ ンプ50の実施例は、バターニングする表面の表面補に 少なくとも等しい面積を有する第1対向面54を含む。 |大面積スタンプ50の可撓性のために||大面積スタンプ 50は、縁部に動かないように固定されると、それ自体 の重量によって垂れ下がる。次に図11を参照すると、 下向きの矢印で表されているように、大面積スタンプ5 が猫かれている。また、接触工程の間、複数の接触面6 ①をレジスト物質層32の外面34に接触させるが、可 撓性物質層52の中に追加の構造的支持体を設けなけれ ば、スタンピング圧力の空間的ばらつきが、第1および 第2の所定パターンに変形を生じる原因となる。

【0015】次に図12および図13を参照すると、本 発明による大面積スタンプ50の2つの実施例が描かれ ている。図12の実施例では、硬質のメッシュ、補強ロ ッド(stiffred)および/またはインターレース補強ファ イバ(Interlaced stiff fiber) を含む、循磁材(stiff 30) eningagent) 68を、可撓性物質層52内に配する。箱 強付68は、第1対向面54からは十分に距離を離して 位置付けることにより、第1対向面54の輪郭特性(con touringproperties)は綺強村68による劣化は生じな い。補強材68は、構造的支持を与え、大面積スタンプ 50の第1および第2の所定パターンを維持する。硬質 メッシュ、縞強ロッド、およびインターレース補強ファ イバは容易に入手可能であり、当技術では一般的に既知 の方法によって形成可能である。図13の実施例では、 箱強村68は、可饒性物質層52内に分散された補強用。 化学物質を含み、第1対向面54の輪郭特性の劣化を招 かないように、第1対向面54から十分な距離をおいて ある。浦強用化学物質の選択は、当業者には明白である う。補強用接着剤ならびにそれらを弾性物質およびその 他の可撓性物質内に分散する技法は、当業者には既知で

【0016】次に図14および図15を参照すると、本 発明による大面積スタンプ50の別の実施例が示されて いる。この特定実施例では、大面積スタンプ50は、可

タルから成る、複数の圧電構造によって形成されたリン グ80を含む。大面積スタンプ50の別の実施例では、 複数の圧電構造は円盤を形成する。圧電クリスタルのリ ング80を用いて大面請スタンプ50を変形し、第1お よび第2の所定バターンの制御および維持を行う。図1 5に示すように、適切な電圧82を大面積スタンプ50 に印触することにより、機械的緒正方を加え、大面積ス タンプ50を伸張する。図15において、初期バターン 84を有し、元々絹正されていない大面積スタンプ86 10 を伸張して、最終パターン90を有する最終的な補正さ れた大面積スタンプ88を形成する。

【0017】次に図16ないし図18を参照すると、本 発明による大面積スタンプ50の別の実施例の構成部品 および最終構造が描かれている。この特定実施例では、 大面積スタンプ50は、図17に示すような、外面94 を有する硬質のシリンダ92を含む。可撓性物質層52 の第2外面56を、硬質シリンダ92の外面94に固着 させることによって、可撓性物質層52を硬質シリンダ 92に取り付ける。この特定実施例では、層52は、部 ①が垂れ下がり、それ自体の重置によって変形した様子 20 分的に外面94を窺ってもよく、あるいは硬質シリンダ 92の周囲全体にわたって連続的に固着してもよく、硬 質シリンダ92が繰り返し外面34上を転動すると、複 数の接触面60が連続的にレジスト物質層32の外面3 4と接触する。

> 【0018】次に図19を参照すると、レジスト物質層 32の外面34に自己集合単分子層36を被着させる、 本発明による装置95の実施例が示されている。この特 定実施例では、装置95は、対象物30および層32を 含む墓板97を保持するように設計された、表面を有す - る支持構造96を含む。また、装置95はスポンジ状基 板98も含み、このスポンジ状基板98は、SAM形成 分子種38を含有する溶液100で飽和されている。更 に、装置95は回転可能な平行移動アーム(translatab) e amm)99を含み、その端部には、図18に描いた大面 **満スタンプ50の実施例が配置される。大面満スタンプ** 50は支持構造96の上に配され、複数の接触面60が スポンジ状基板98とレジスト物質層32の外面34双 方の上を転動し、これらと接触可能となっている。アー ム99は、大面積スタンプ50をスポンジ状基板98上 40 で回転させかつ平行移動させ(translate)、複数の接触 面60を溶液100で濡らす。次に、大面積スタンプ5 ○を外面34上で転動させ、複数の接触面60が外面3 4と物理的に接触することにより、外面3.4上にSAM 36を形成する。

【0019】次に図20を参照すると、レジスト物質層 32の外面34に、自己集合単分子層36を皱着させ る。本発明による装置95の別の実施例が示されてい る。この装置95の特定実施例はブラシまたはスプレー を含み、これが複数の接触面60の一部を濡らし、一方 鏡性物質層52の内部に埋め込まれた複数の圧電クリス 50 複数の接触面60の別の部分が外面34と接触して、S

(6)

特別平10-12545

10

AM36を形成する。このように、複数の機能面60を 濡らし、複数の接触面60を外面34と接触させる工程 は、アーム99の作用によって大面積スタンブ50を基 板97上を転動させる際に、同時に実施可能である。

【0020】以上、本発明の具体的な実施例について示しかつ説明してきたが、とれ以外の変更や改良も当業者には想起されよう。したがって、本発明はここに示した特定形態に限定されるものではないと理解されることを望み、本発明の精神および範囲から逸脱しない全ての変更は特許請求の範囲に含まれることを意図するものである。

【図面の簡単な説明】

【図1】自己集合単分子層を利用して対象物にバターニングを行うプロセスの工程に対応する。対象物および構造を示す補衡面図。

【図2】自己集合単分子層を利用して対象物にバターニングを行うプロセスの工程に対応する。対象物および構造を示す満断面図。

【図3】自己集合単分子層を利用して対象物にバターニングを行うプロセスの工程に対応する。対象物および構造を示す構断面図。

【図4】自己集合単分子層を利用して対象物にバターニングを行うプロセスの工程に対応する。対象物および構造を示す補断面図。

【図5】自己集合単分子層を利用して対象物にバターニングを行うプロセスの工程に対応する。対象物および構造を示す構飾面図。

【図6】自己集合単分子層を利用して対象物にバターニングを行うプロセスの工程に対応する。対象物および構造を示す補筋面図。

【図?】本発明による大面積スタンプの実施例を示す等 幅図。

【図8】図7の大面積スタンプの接触面によって規定される第1の所定バターンを示す平面図。

【図9】図7の大面積スタンブの押込によって規定される第2の所定パターンを示す平面図。

【図10】本発明によるスタンプ鋳造原型の一実施例を示す等幅図。

【図 1 1 】本発明による大面積スタンプの別の実施例を 示す側面図。

【図12】本発明による大面積スタンプの更に別の実施 例を示す側面図。 *【図13】本発明による大面積スタンプの更に別の実施 例を示す側面図。

【図】4】本発明による大面積スタンブの更に別の実施 例を示す側面図。

【図15】電圧懸からの電圧印加によって伸張した図1 4の実施例の概略平面図。

【図16】本発明による大面積スタンプの別の実施例を示す等幅図。

望み、本発明の精神および簡問から逸脱しない全ての変 【図17】本発明による、観質シリンダ、および図16 更は特許請求の簡問に含まれることを意図するものであ 10 の大面請スタンプと図18のシリンダとの組み合わせを る。 示す等幅図。

> 【図18】本発明による。鍵質シリンダ、および図16 の大面積スタンプと図18のシリンダとの組み合わせを示す等幅図。

> 【図19】対象物の表面に分子種の自己集合単分子層を 被着させる、本発明による装置の実施例を示す等幅図。

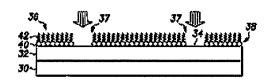
> 【図20】対象物の表面に分子種の自己集合単分子層を 被着させる、本発明による装置の別の実施例を示す等幅 図。

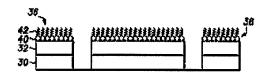
20 【符号の説明】

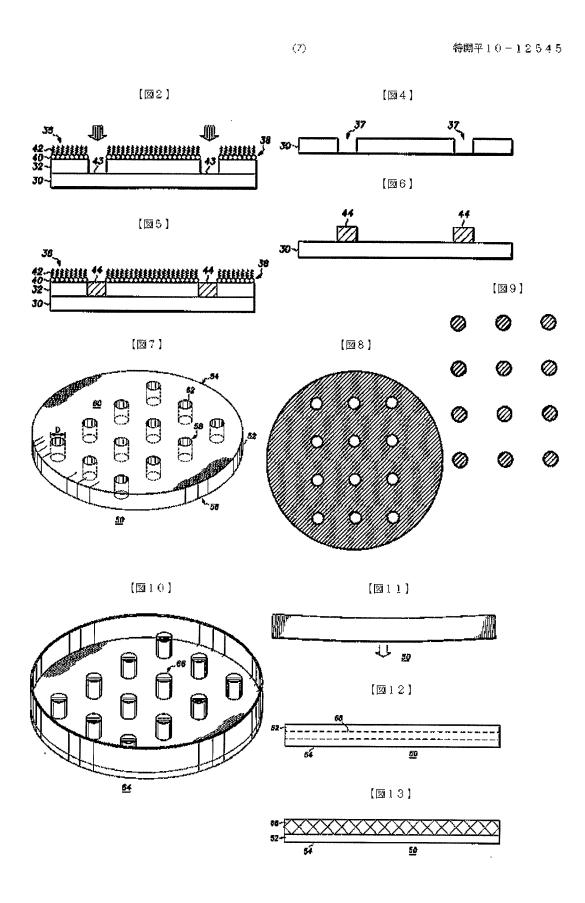
- 30 対象物
- 32 レジスト物質層
- 38 自己集合单分子層
- 4.0 第1の官能基
- 4.2 第2の官能基
- 4.4 メッキ物質
- 50 大面積スタンプ
- 5.2 可撓性物質層
- 54 第1対向面
- 30 56 第2対向面
 - 58 レリーフ
 - 60 接触面 62 押込
 - 64 スタンプ鋳造原型
 - 68 箱強村
 - 80 リング
 - 92 硬質シリンダ
 - 9.5 装置
 - 96 支持構造
- 10 97 基板
 - 98 スポンジ状基板
 - 100 溶液

[21]

[203]



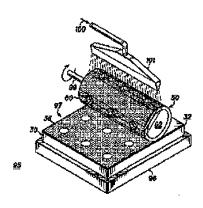




(9)

特開平10-12545

[**2**0]



フロントページの続き

(72)発明者 ハーバート・ゴロンキン アメリカ合衆国アリゾナ州テンピ、サウ ス・カチャイナ・ドライブ8523 (72)発明者 ローレンス・エヌ・ドワスキー アメリカ合衆国アリゾナ州スコッツデー ル、イースト・コチャイズ・ドライブ9638